Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/735,908	HAN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Tran N. Nguyen	2834	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
310	211 156.08	2/28/	That	
	156.12	705		
310	156, 23	1 7.53	TAIR)
	156.26	 		
	156,29	7/2	+7	
310	156.81	3/3/05	TINN	
iplate	above	6/23/06	Post	-
		,		
			·	

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
	L				

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
•				
		 		
·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
•				
•	. :			
	·			
·				